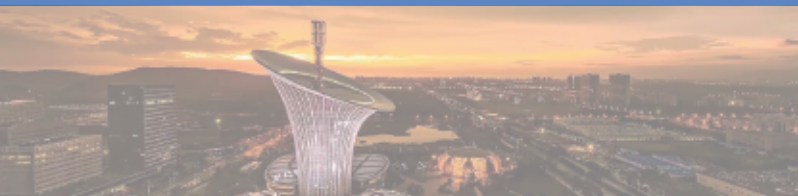


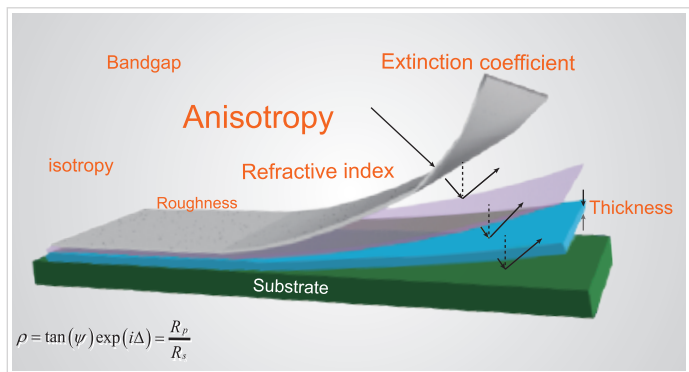


SE-VM 型光谱椭偏仪

SE-VM Spectroscopic Ellipsometer

- 高精度、高性价比光学椭偏测量解决方案
- 多角度配置、微光斑集成设计，一键快速测量
- 向导交互式人机界面，便捷的软件操作体验
- 丰富的材料数据库和算法模型库，强大的数据分析能力



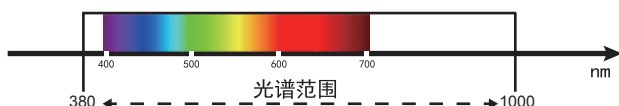


SE-VM 是一款高精度、高性价比、快速测量型光谱椭偏仪，其配置多角度调节、集成微光斑设计，可通过椭偏参数、透射/反射率等参数的测量，实现各种各向同性/各向异性薄膜膜厚以及光学常数快速测量表征分析。

产品特点

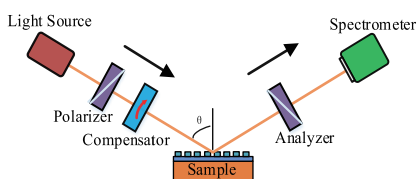
■ 光谱范围覆盖广

采用高性能卤素灯光源，光谱覆盖可见光到近红外范围；



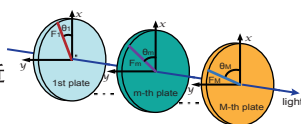
■ 单旋转补偿器调制技术

高精度旋转补偿器调制、PCrSA配置，实现Psi/Delta光谱数据高速采集；



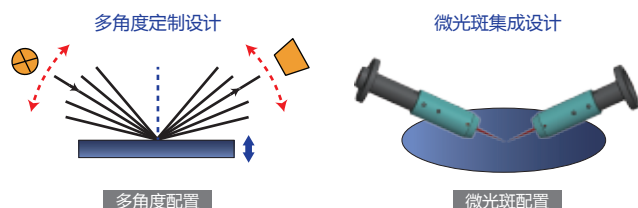
■ 消色差补偿器设计

顾光专利补偿器技术，适应从可见光到近红外宽光谱范围内高精度相位调制需求；



■ 多角度配置、微光斑集成设计

支持多角度定制化设计，集成微光斑测量能力，可实现各式基底材料或各待测区域的角度择优测量；



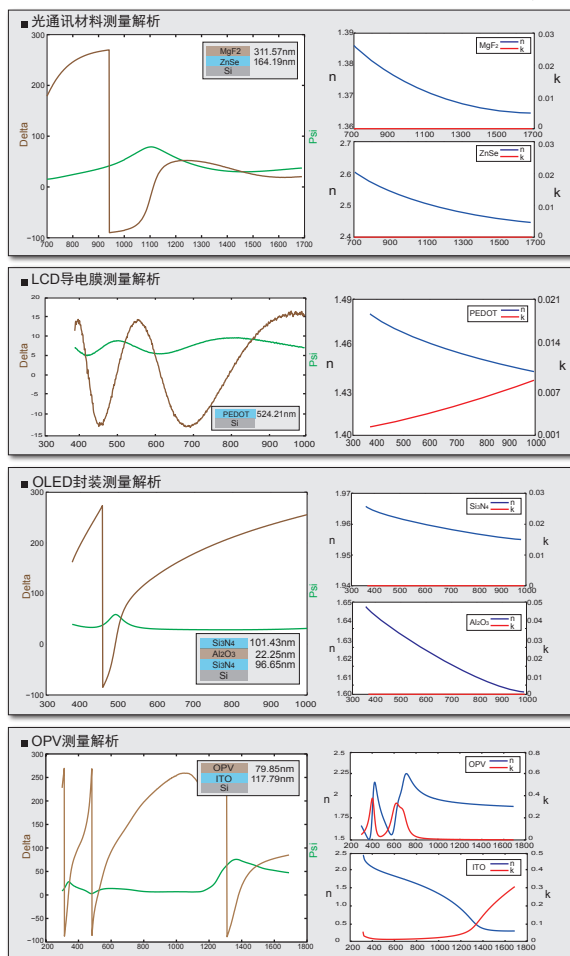
■ 丰富的材料数据库和算法模型

数百种材料数据库、多种算法模型库，涵盖了目前绝大部分的光电材料；

Basic	Dielectric	Semiconductor	Metal
Bspline.dat Cauchy.dat CodyLor.dat Sellmeier.dat Cody-Lorentz.dat Temp-Library.dat Forouhi-bloomer.dat Tauc-Lorentz.dat Tanguy.dat Gaussion.dat Lorentz.dat	Al ₂ O ₃ .dat BaTiO ₃ .dat CaF ₂ .dat CuO.dat DLc.dat IPA.dat ITO.dat KBr Palik.dat KCl Palik.dat LaF ₃ .dat LiF.dat LiNbO ₃ .dat MgO.dat	AlAs.dat AlGaAs2.dat AlN.dat AlSb.dat B-SiC.dat BN_hex_e_Adachi.dat CdS_O.dat CdTe_Oxide.dat GaAs.dat GaN.dat GaSb.dat HgTe.dat In ₂ Se ₃ .dat InP3.dat	Ag.dat Al.dat Au.dat Cd.dat Co.dat Cr.dat Cu.dat Fe.dat Ir.dat Mo.dat Nb.dat Ni.dat Pd.dat Ti.dat

■ 强大软件应用分析能力

针对半导体、集成电路、新型平板显示、薄膜光伏等领域中材料的厚度、光学常数、结构信息等数据通过建模拟合进行全面的快速分析；



技术参数

基本功能	一次性获取Psi/Delta、N/C/S、R/T等光谱
光谱范围	380-1000nm
测量时间	0.5-5s
入射角范围	55°-75° (5° 步进调节), 90° (直通模式)
光斑尺寸	2-3mm (大光斑), 200μm (微光斑)
重复性精度	0.01nm (100nmSiO ₂ 硅片)
支持样件尺寸	支持180mm样件
分析软件	多达数百种的光学材料数据库，支持用户自定义 提供多层各向同性/异性光学薄膜建模仿真与分析功能

产品应用

SE-VM 型光谱椭偏仪广泛应用于镀膜工艺控制、tooling校正等测量应用，实现光学薄膜、纳米结构的光学常数和几何特征尺寸快速的表征分析；

